

Keithley4200-SCS 吉时利半导体特性分析系统

产品名称	Keithley4200-SCS 吉时利半导体特性分析系统
公司名称	东莞市宸健电子科技有限公司
价格	4200.00/台
规格参数	
公司地址	广东东莞常平信鸿智谷A栋1101
联系电话	17802099856 17802099856

产品详情

简述：

4200-SCS半导体特性分析系统是用于器件、材料和半导体工艺参数分析的完整解决方案。这种先进的参数分析仪具有无可比拟的测量灵敏度和精度，同时继承了嵌入式Windows操作系统和吉时利交互式测试环境，为半导体科研及产业用户进行半导体器件特性分析提供了直观而**的功能

特征：

运行 Clarius SW on Win7 嵌入式计算机的直观、触摸屏界面。独特的可选远端前置放大器将 SMU 的分辨率扩展至 10 aACV 仪器使 CV 测量像 DC IV 一样简单用于**半导体测试的脉冲和脉冲 IV 功能示波器卡提供集成的示波器和脉冲测量功能独立的 PC 提供快速的测试设置、强大的数据分析、图形和打印以及测试结果的板载大容量存储。配备嵌入式测量专业知识和数百个即用型应用测试，用于点击式可靠性测试的内置压力/测量、循环和数据分析，包括五个符合 JEDEC 标准的样品测试集成支持各种 LCR 仪表、Keithley 开关矩阵配置以及 Keithley 3400 系列和 Agilent 81110 脉冲发生器包括用于领先分析探针的软件驱动程序

吉时利 4200A-SCS 半导体参数分析仪表征系统执行实验室级 DC 和脉冲器件表征、实时绘图和分析，具有高精度和亚 fem 到安培的分辨率。Keithley 4200A-SCS 提供同步电流-电压 (IV)、电容-电压 (CV) 和超快脉冲 IV 测量。

吉时利4200-SCS型半导体特征分析系统主要特点及优点：

直观的、点击式Windows操作环境

独特的远端前置放大器，将SMU的分辨率扩展至0.1nA

用于**半导体测试的新型脉冲与脉冲式I-V功能

集成了示波与脉冲测量功能的新型示波卡

内置PC提供快速的测试设置、强大的数据分析、制图与打印、以及测试结果的大容量存储

独特的浏览器风格的软件界面，根据器件的类型来安排测试，可以执行多项测试并提供测试序列与循环控制功能

内置了Stress/Measure，循环和数据分析功能，通过鼠标点击方式就可进行可靠性测试，包括5个JEDEC规范的样品测试

支持Keithley590型与Agilent 4284/4294型C-V仪、Keithley开关矩阵与Agilent 81110脉冲发生器等多种外围设备

硬件由Keithley交互式测试环境（KITE）来控制，用户测试模块功能，可用于外接仪表控制与测试平台集成，是KITE功能的扩充

包括驱动软件，支持CascadeMicrotech Summit 12K系列、Karl Suss PA-200和PA-300，Micromanipulator的8860自动和手动探针台

支持先进的半导体模型参数提取，包括IC-CAP和Cadence BSIMProPlus/Virtuoso

Keithley吉时利4200-SCS型半导体特性分析系统用于实验室级的器件直流参数测试、实时绘图与分析，具有高精度和亚fA级的分辨率。Keithley吉时利4200-SCS提供了*先进的系统集成能力，包括完整的嵌入式PC机，WindowsNT操作系统与大容量存储器。其自动记录、点击式接口加速并简化了获取数据的过程，这样用户可以更快地开始分析测试结果。

KEITHLEY吉时利4200-SCS 相关应用：

半导体器件

片上参数测试

晶圆级可靠性

封装器件的特性分析

使用Model4200-SCS控制外部LCR表进行C-V、I-V特性分析

高K栅电荷俘获

易受自加热效应影响的器件和材料的等温测试

电荷泵方法分析MOSFET器件的界面态密度

电阻式或电容式MEMS驱动特性分析

光电器件

半导体激光二极管DC/CW特性分析

收发模块DC/CW特性分析

PIN和APD特性分析

科技开发

· 碳纳米管特性分析

材料研究

电化学